

รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
ใบรับรองเลขที่ 20C061/0740

ชื่อห้องปฏิบัติการ บริษัท ยามาเซ็น (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ เลขที่ 1230 และ 1230/1 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

หมายเลขการรับรองที่ สอบเทียบ 0264

สถานภาพห้องปฏิบัติการ ถาวร นอกสถานที่ ชั่วคราว เคลื่อนที่

สาขาการสอบเทียบ	รายการสอบเทียบ	ขีดความสามารถของการสอบเทียบและการวัด*	วิธีการสอบเทียบ
1. มิติ	Vernier, Dial, and Digital Caliper		In-house method : WI-D1-001 based on JIS B 7507 : 1993
	External measurement		
	0 mm to 300 mm	14 μm	
	> 300 mm to 600 mm	16 μm	
	Internal measurement		
	0 mm to 300 mm	14 μm	
	> 300 mm to 600 mm	16 μm	
	Depth measurement		
	0 mm to 300 mm	15 μm	
	Micrometer Caliper for external measurement		In-house method : WI-D1-002 based on JIS B 7502 : 1994
0 mm to 25 mm	1.4 μm		
> 25 mm to 50 mm	1.6 μm		
> 50 mm to 75 mm	1.7 μm		
> 75 mm to 100 mm	2.0 μm		
> 100 mm to 125 mm	2.2 μm		
> 125 mm to 150 mm	2.5 μm		

* ค่าความไม่แน่นอน (\pm) ที่ระดับความเชื่อมั่นประมาณ 95%

รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
ใบรับรองเลขที่ 20C061/0740

หมายเลขการรับรองที่ สอบเทียบ 0264

สถานภาพห้องปฏิบัติการ ถาวร นอกสถานที่ ชั่วคราว เคลื่อนที่

สาขาการสอบเทียบ	รายการสอบเทียบ	ขีดความสามารถของการสอบเทียบและการวัด*	วิธีการสอบเทียบ
1. มิติ (ต่อ)	Dial Test Indicator		In-house method :
	0 mm to 0.14 mm	1.3 μm	WI-D1-003 based on
	> 0.14 mm to 0.6 mm	2.4 μm	JIS B 7533 : 1990
	> 0.6 mm to 1.6 mm	12 μm	
	Dial Gauge		In-house method :
	0 mm to 5 mm	1.6 μm	WI-D1-004 based on
	> 5 mm to 10 mm	13 μm	JIS B 7503 : 1997
	Vernier, Dial, and Digital Height Gauge		In-house method :
	0 mm to 300 mm	15 μm	WI-D1-005 based on
> 300 mm to 600 mm	16 μm	JIS B 7517 : 1993	
* ค่าความไม่แน่นอน (\pm) ที่ระดับความเชื่อมั่นประมาณ 95%			

รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
ใบรับรองเลขที่ 20C061/0740

หมายเลขการรับรองที่ สอบเทียบ 0264

สถานภาพห้องปฏิบัติการ ถาวร นอกสถานที่ ชั่วคราว เคลื่อนที่

สาขาการสอบเทียบ	รายการสอบเทียบ	ขีดความสามารถของการสอบเทียบและการวัด*	วิธีการสอบเทียบ
1. มิติ	Surface roughness Measuring Range Detector Z-axis up to 800 µm X-axis up to 100 mm Ra Rz Rsm	$\sqrt{0.39^2 + (0.015 Z_m)^2}$ µm (Z _m : being the measured value in µm) $\sqrt{0.56^2 + (0.075 Z_m)^2}$ µm (Z _m : being the measured value in µm) $\sqrt{0.75^2 + (0.0041 X_m)^2}$ µm (X _m : being the measured value in µm)	In-house method : WI-D1-006 based on ISO 12179 : 2000
* ค่าความไม่แน่นอน (±) ที่ระดับความเชื่อมั่นประมาณ 95%			

ออกให้ ณ วันที่